HAXPES II ビームライン BL46XU の現状

公益財団法人高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 産業利用・産学連携推進室 安野 聡、SEO Okkyun

公益財団法人高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 分光推進室

高木 康多、保井 晃

1. はじめに

硬 X 線光電子分光 (HAXPES、HArd X-ray PhotoElectron Spectroscopy) は数 keV~15 keV の 硬X線を励起光として用いる光電子分光(XPS、X-ray Photoelectron Spectroscopy) であり、一般に普及し ている軟 X 線の XPS に比べて、検出される光電子の 運動エネルギーが数倍大きく、検出深さが数十nm 程 度にまで大きくなる特徴を持つ。これにより試料深 部の電子状態や結合状態を非破壊で調べることが可 能となり、近年は学術分野での利用の他、デバイス開 発や実用材料などの産業利用をはじめとした様々な 研究分野における分析評価ツールとして定着してい る。SPring-8 では、その有用性と汎用性の高さから複 数のビームラインで運用され、目的や対象の試料構造 によった使い分けがなされ利用が進んできた^[2]。一方 で、これまでは HAXPES の運用や技術開発がビーム ライン・装置毎に独自に行われ、制御ソフトやサンプ ルホルダー等でビームライン・装置間に統一性が無い など、ユーザビリティの向上や効率的な運用と技術開 発の点で課題があった。このため、我々はこれまでに SPring-8 における共用 HAXPES アクティビティを BL46XU 及び BL09XU へ集約し、効率的なビームラ

イン運用と既存の利用ニーズ及び今後の潜在的なニ ーズに幅広く対応することをコンセプトとして検討 しビームラインの改変を進めてきた。先行する BL09XU (HAXPES I) では既にビームラインのアッ プグレード作業と2台の HAXPES 装置の導入、コミ ッショニングが終了し、2021B 期にユーザーへの供用 が開始された^{13.4}。さらに BL46XU においても、2022 年 12 月より光学系から計測装置に亘る大規模なアッ プグレードを実施し、BL09XU に続く2番目の HAXPES 専用ビームライン"HAXPES II"として 2023年7月よりユーザー利用を開始した。表1に BL09XU 及び BL46XU の各 HAXPES 装置の特徴を まとめたものを示す。

アップグレード後の BL46XU のビームラインレイ アウトを図1に示す。

表 1 BL09XU 及び BL46XU における各 HAXPES 装 置の特徴。

実験ハッチ	BL09XU (HAXPES I)	BL46XU (HAXPES II)
EH1	共鳴・高分解能	自動測定
EH2	3次元空間分解	大気圧測定



図1 BL46XU(HAXPES II)のビームラインレイアウト。

今回実施したアップグレードの主な特徴を以下に 示す。

(1) 2つの異なる特徴を持つ HAXPES 装置の導入

上流の実験ハッチ1(EH1)には自動測定に特化し たハイスループット HAXPES 装置、下流の EH2 には ガス雰囲気下での測定が可能な大気圧 HAXPES 装置 を整備した。特に大気圧 HAXPES 装置は国内初の共 同利用であり、ガス・湿潤雰囲気下の測定に対応し、 固気・固液界面反応など幅広い利用が見込まれる。

(2) ダブルチャンネルカット結晶分光器の導入

従来は Si(111)のチャンネルカットモノクロメーター (CCM、Channel-cut Crystal Monochromator)の Si 333、Si 444、Si 555 反射を用いていたため励起エ ネルギーが6, 8, 10 keV に限定されていた HAXPES 計測において、定位置出射化により励起エネルギーの 選択性が大幅に拡大した。また、Si(220)と Si(311)の 2 種類の結晶を使い分けることで、分析目的に応じて 最適な励起X 線条件 (分解能、フラックス)を選択で き、効率的な実験が可能になった。Si(311)は 5.5~ 21.8 keV、Si(220)は 5.5~18.5 keV のエネルギー範 囲における使用が可能である。

(3) Wolter 集光ミラーの導入

EH1 及び EH2 の HAXPES 装置の前にそれぞれ Wolter 集光ミラーを新設し、高フラックスかつ安定性 の高い X 線の利用が可能となった。また再集光時の再 現性が高い特徴を持ち、実験ハッチ切替時間の短縮化 によるビームタイムの高効率利用にも繋がっている。

(4) 新しい制御系システム BL774 の導入

BL774 は光学系機器・HAXPES 装置を同じプラッ トフォーム上で制御できるシステムである^[5]。これに より、機器間連携が容易になり、将来の自動計測実現 につながる。加えて BL09XU を含めた SPring-8 の各 ビームラインへの導入が進められており、BL09XU と の制御系ソフトウエアの共通化などさらなるユーザ ビリティの向上が期待できる。

本アップグレードや新規装置の導入は、今後の一層 の成果創出やユーザーの利便性向上に繋がるものと 考えている。本報告では、コミッショニングで得られ たビームラインスペックを紹介するとともに、光学系 機器、及び、HAXPES 装置の整備状況について報告す る。

2. 光学ハッチに関する整備状況

光学ハッチでは、二結晶分光器以外の機器がほぼ全 て一新され、X線の性能や利便性が大幅に向上した。 上流側より、X線の特性向上や将来の低エネルギー利 用を目的とした差圧排気高速遮断アブソーバー&ゲー トバルブ機構(これにより FE 部と光学ハッチ間に設 置されていた Be 窓の撤去が可能に)、X線エネルギー の高分解能化のためのダブルチャンネルカットモノク ロメーター (DCCM、Double Channel-cut Crystal Monochromator)機構、偏光依存性計測を可能にす るダイヤモンド移相子 (XPR、X-ray Phase Retarder) 機構、厚みの異なる Al 及び Si フィルターを選択して 所望のフラックスに調整することで試料帯電やダメ ージの緩和を行うアッテネーター機構などを新設し た。特に今回導入した DCCM は2つの CCM を組み 合わせた機構となっており、先述した通りエネルギー を変更させても出射位置が変わらない特徴がある。従 来(1つの CCM)に比べて、簡便に X線エネルギー が変更できるため、例えば試料構造に最適なX線エネ ルギー条件(光電子の脱出深さ・分析深さ)での測定 が実現できるなど、X線エネルギーを自在に選択でき る放射光の特徴を活かした HAXPES 測定が可能とな った。また、Si(311)とSi(220)の2種類の結晶を整備 しており、分解能やフラックスなど目的に応じた使い 分けが可能である。

図2にDCCM Si(311)とSi(220)におけるX線エネ ルギーと総エネルギー分解能(HAXPES アナライザー の分解能を含む)の関係を示す。尚、測定にはAu箔 を使用し、12及び15keVの測定データは、アナライ



 図 2 X 線エネルギーと総エネルギー分解能の関係。
HAXPES 測定条件:パスエネルギー100 eV、Slit 0.3 mm。



図3 X線エネルギー7.94 keV における光電子強度及 び総エネルギー分解能のパスエネルギー依存性評 価結果。図中の実線は光電子強度、波線は総エネ ルギー分解能を示している。Slit 0.3 mm は分散 方向のアナライザースリットサイズを示している。

ザーで計測可能な 10 keV (光電子の運動エネルギー) 以下となるように、試料に正電圧を印加して測定を実施している。またこれを含む以下の全てのデータは室 温で得たものである。得られた分解能は、BL09XU で 得られたものとほぼ同等であった。その他、HAXPES のアナライザー条件を組み合わせることで、光電子強 度や分解能の選択範囲をさらに広げることができる。 図3に Au 箔試料における X 線エネルギー7.94 keV の光電子強度 (Au 4f ピーク)及び総エネルギー分解 能のパスエネルギー依存性の評価結果を示す。このよ うに適当な DCCM とアナライザー条件を組み合わせ ることで、試料構造や目的に応じて最適な測定条件 (分解能、フラックス、光電子強度)を選択した計測 を行うことができる。

 実験ハッチ1(EH1)ハイスループット HAXPES 装置に関する整備状況

EH1 の HAXPES 装置では、近年の共用 HAXPES 全体における高い競争率を緩和するとともに多種試 料のコンビナトリアル測定等を実現すべくハイスル ープット化を目指した自動計測 HAXPES 装置の開発 を行っている。本装置は以前に BL46XU EH2 に設置 されていた汎用 HAXPES 装置を EH1 に移設したも のをベースとしており、これまでに高精度試料位置調 節機構(6軸マニピュレーター)と自動試料搬送機構 の導入を行ってきた。図4に自動試料搬送機構の概要 (イメージ図、写真)を示す。試料の搬送は測定チャ ンバー下部へ設置されたロードロックチャンバー内 でストッカーを交換することによって行われる。現状 では、ロードロックチャンバーは一度に4つのストッ カーを格納して真空排気することが可能な構造とな っている。ストッカーは図 5(a)のようなものであり、 BL09XU と共通のサンプルホルダーを4 つ格納でき



図 4 BL46XU EH1 に設置された HAXPES 装置用自 動試料搬送機構。(a)イメージ図、(b)装置全体写真、 (c)ロードロックチャンバー。図(a, b)中の数字は (1)測定チャンバー、(2)ロードロックチャンバー、 (3)6 軸マニピュレーターをそれぞれ示している。



図5 (a)サンプルホルダー用ストッカー、(b)サンプルマ ウント型ストッカー。

SPring-8/SACLA 通信

る構造を有する。両ビームラインを利用するユーザー において、同一サンプルの持ち回り測定など利便性向 上に繋がることを期待している。この他、これまでに ユーザーより要望のあった大型もしくは厚みのある サンプル形状へ対応するため、ストッカー自体にサン プルマウント機能を持たせたタイプも整備している (図 5(b))。今後、試料搬送などの制御系から計測系 を統一的に扱うアプリケーション開発を行うなど、完 全自動計測にむけた技術開発を行っていく予定であ る。

実験ハッチ2 (EH2) 大気圧 HAXPES 装置に関する整備状況

EH2 にはガス雰囲気下の試料に対する XPS 測定が 可能な大気圧 HAXPES 装置が設置された(図6)。本 装置は SPring-8 の BL36XU で運用されていたもの で、本ビームラインアップグレードに合わせて BL46XU の EH2 に移設され、共用ビームラインの装 置として一般供用が開始された。従来の XPS 装置は 真空下の試料しか測定できなかったが、本装置はアナ ライザー先端の小径アパーチャーとアナライザー前 段の差動排気部により、試料の周囲のガス圧を上げて もアナライザー内の真空度が維持されるためガス雰 囲気下の試料の HAXPES 測定が可能である。

アナライザーには Scienta Omicron 社の差動排気 型アナライザーR4000 Hipp-2 を用いている。標準の アパーチャーは Ø 300 µm であり、カタログスペック として 5000 Pa までのガス圧の測定に対応している。 一方で、Ø 30 µm のアパーチャーを独自開発し、標準 のアパーチャーと交換して利用することで、測定圧力 を大気圧まで引き上げることに成功した⁶⁶。今回のビー



図6 BL46XU EH2 に設置された大気圧 HAXPES 装置。

ムラインのアップグレードに伴い、ビームの集光サイ ズが BL36XU に比べより小さくなり、試料位置で約 横 10 µm × 縦 1 µm の集光ビームの利用が可能であ る。アパーチャー形状をビームに合わせることでより 効率の良い測定が可能あることから、本アップグレー ドにおいて、従来の円形ではなく横 80 µm × 縦 20 µm の長方形にしたものを作製した(図 6)。このアパーチ ャーを用いた場合でも、試料周りを大気圧にしてもア ナライザー内部は 10⁵ Pa 以下を維持しており、大気 圧下の試料の測定も問題なく行えている。

測定槽に 0.1 気圧 (10 kPa)の大気を導入し、ガス そのものを測定した際のスペクトルを図7に示す。試 料を入れずに測定槽内をガスで満たしており、入射X 線がアナライザーのアパーチャー前の大気成分を励 起し放出された光電子をアナライザーで分光してい る。入射光エネルギーは 7.94 keV、集光サイズは 10 μm × 1 μm である。

サーベイスキャンでは大気中の窒素分子と酸素分子からのピークが得られている。特に酸素分子からの O 1s ピークは酸素分子がスピンをもつことに由来して 1.1 eV の分裂が起きている¹⁷。一方、測定槽に水を 導入し、飽和水蒸気圧の 4000 Pa で満たして測定した結果も図7に併せて示す。このサーベイスキャンで は水分子の酸素からのピークが得られた。この O 1s



図 7 大気 10 kPa と水蒸気 4000 Pa の HAXPES ス ペクトル。

ピークは酸素分子からのピークよりも 3.5 eV ほど低 エネルギー側にあり、また分裂もしていない。このよ うにガスにおいても酸素原子の化学状態を反映した スペクトルが得られている。

本装置ではガス雰囲気下での測定が可能であり、今 後は固体試料を導入してガスとの反応時のオペラン ド測定や水蒸気下に試料を導入して乾燥を嫌う試料 の湿潤状態での測定などを行っていく予定である。

5. 最後に

本アップグレードにより、BL46XU は光学系から計 測装置に関して大幅な性能の向上を達成した。正確な 比較は励起X線の分解能やアナライザー、測定条件に よるためにできないが、光電子強度は本アップグレー ド前に比べ1000倍程度に改善している。こうしたシグ ナルの高強度化や DCCM による励起 X 線エネルギー の選択性の向上を活かし、従来では検出が困難であっ た電子状態や化学結合状態の微弱な変化の観測、実用 的な大気圧測定の実現、これまでにない HAXPES を ベースとした新しい測定技術の開発などを進めてい く。またさらなるユーザーの利便性向上を進めるべく BL09XU との各機器、制御系の共通化にも取り組みた い。BL46XU 及び BL09XU のそれぞれ 2 台で計 4 台 の HAXPES 装置を使い分けることで、SPring-8 全体 で幅広い測定対象や分析に対応できる体制を構築し ていく。

謝辞

本ビームラインアップグレードには非常に多くの 方々の御尽力をいただきました。光学系全般に関して は、理化学研究所の大坂様、JASRI ビームライン技術 推進室の大橋様、仙波様、山崎様、小山様、清水様、 齊藤様の御協力をいただきました。また、現場工事作 業では、理化学研究所の菅原様、エンジニアリングチ ームの皆様、JASRI のテクニカルスタッフの皆様の御 協力をいただきました。BL774 関連では、理化学研究 所の本村様、中嶋様の御協力をいただきました。本ビ ームラインアップグレード全体につきまして、理化学 研究所の矢橋様、玉作様、JASRI の為則様、佐藤様、 河村様の御協力をいただきました。この場を借りて御 礼申し上げます。 参考文献

- [1] K. Kobayashi: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A601 (2009) 32-47.
- [2] C. Kalha et al.: J. Phys. Condes. Matter 33 (2021) 233001.
- [3] 保井晃、高木康多: SPring-8/SACLA 利用者情報 26 (2021) 445-447.
- [4] A. Yasui et al.: J. Synchrotron Rad. 30 (2023) 1013-1022.
- [5]K. Nakajima et al.: J. Phys. Conf. Ser. 2380 (2022) 012101.
- [6] Y. Takagi *et al.: App. Phys. Exp.* **10** (2017) 076603.
- [7] J.D.Lee: J. Surf. Analysis 16 (2009) 127-152.

<u>安野 聪 YASUNO Satoshi</u>

(公財)高輝度光科学研究センター
放射光利用研究基盤センター 産業利用・産学連携推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL: 0791-58-0924
e-mail: yasuno@spring8.or.jp

<u> ソ オッキュン SEO Okkyun</u>

(公財)高輝度光科学研究センター
放射光利用研究基盤センター 産業利用・産学連携推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0924
e-mail:seo.okkyun@spring8.or.jp

<u>高木 康多 TAKAGI Yasumasa</u>

(公財)高輝度光科学研究センター
放射光利用研究基盤センター 分光推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail:ytakagi@spring8.or.jp

<u>保井 晃 YASUI Akira</u>

(公財)高輝度光科学研究センター
放射光利用研究基盤センター 分光推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail:a-yasui@spring8.or.jp